

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【公表番号】特表2010-501855(P2010-501855A)

【公表日】平成22年1月21日(2010.1.21)

【年通号数】公開・登録公報2010-003

【出願番号】特願2009-525604(P2009-525604)

【国際特許分類】

G 01 N 23/04 (2006.01)

【F I】

G 01 N 23/04

【誤訳訂正書】

【提出日】平成24年11月21日(2012.11.21)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0031

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0031】

図4bに示す重み関数は、実装が特に簡単であり、また、全体として、またはウィンドウの中間点から測定して、0周期の範囲を表わす単独値によってパラメータ化しやすい。

図4に示す関数をパラメータ化する一例においては、この関数を

【数29】

$$Fn_i(A, B)$$

で表わすことができ、ここでAは、測定ウィンドウに取り込まれるサンプルの数を表わし、Bは、非ゼロ重みが適用される第1の部分41(サンプルセットとみなすことができる)で発生するサンプル数を表わす。ハードウェアまたはシステムは、このパラメータ化から、非ゼロ重みづけが適用される測定ウィンドウ内の第2の部分42の存在を推論することができる。後述するように、このパラメータ化方式は拡張可能である。